

Modul

LMK - Lichtmikroskopie

Bachelor Elektrotechnik 2020

Version: 1 | Letzte Änderung: 19.09.2019 15:05 | Entwurf: 0 | Status: vom Modulverantwortlichen freigegeben | Verantwortlich: Altmeyer

^ Allgemeine Informationen

Anerkannte Lehrveranstaltungen	LMK Altmeyer
Fachsemester	5
Dauer	1 Semester
ECTS	5
Zeugnistext (de)	Lichtmikroskopie
Zeugnistext (en)	Light microscopy
Unterrichtssprache	deutsch oder englisch
abschließende Modulprüfung	Ja

Modulprüfung

Benotet	Ja
Frequenz	Jedes Semester

Prüfungskonzept

Sow weit die Prüfungszahl nicht zu groß ist, wird eine mündliche Prüfung gegenüber einer schriftlichen Prüfung bevorzugt.

In der Prüfung werden auf unterstem Kompetenzniveau Kenntnisse abgefragt. Dies sind beispielsweise die Baugruppen, die in jedem Mikroskop enthalten sind, der Auflicht- und Durchlicht Strahlengang in einem Mikroskop mit Köhler'scher Beleuchtung, der Einbauort von Ringblende und Phasenring in einem Zernike Phasenmikroskop oder der Grund für die Richtungssensitivität in einem Mikroskop mit Differentiellen Interferen Kontrast.

Auf nächster Kompetenzstufe werden Fertigkeiten geprüft. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die erforderlichen technischen Schlüsselparameter von Bauteilen in Mikroskopen berechnet werden, entweder auf der Basis von vorgegebenen Anwendungs-Spezifikationen oder auf der Basis von anderen, bereits verbauten Komponenten. Ebenso kann geprüft werden, ob die Einrichtung der Köhlerschen Beleuchtung begründet(!) in allen Schritten beschrieben werden kann.

Die höchste prüfbare Kompetenzstufe betrifft die Methodenkompetenz. Deren Ausprägung kann überprüft werden, indem ein Anwendungsfall geschildert wird: Eine Aufgabe könnte sein, den Krümmungsradius einer Linsenoberfläche mit einem Mikroskop zu bestimmen. Hier ist die Auswahl des richtigen Mikroskopes entscheidend und auch der Messvorgang und die Auswertung bedürfen einer gut entwickelten Methodenkompetenz. Eine weitere Aufgabe könnte sein, die Phasenverschiebung zwischen zwei Objektstrukturen quantitativ auszumessen.

^ Allgemeine Informationen

Inhaltliche Voraussetzungen

Kompetenzen

Kompetenz	Ausprägung
Finden sinnvoller Systemgrenzen	Vermittelte Kompetenzen
Abstrahieren	Vermittelte Kompetenzen
Naturwissenschaftliche Phänomene in Realweltproblemen erkennen und erklären	Vermittelte Kompetenzen
Erkennen, Verstehen und analysieren technischer Zusammenhänge	Vermittelte Kompetenzen
MINT Modelle nutzen	Vermittelte Kompetenzen
MINT-Grundwissen benennen und anwenden	Vermittelte Kompetenzen
Technische Zusammenhänge darstellen und erläutern	Vermittelte Kompetenzen
Technische Systeme analysieren	Vermittelte Kompetenzen
Technische Systeme realisieren	Vermittelte Kompetenzen
Technische Systeme prüfen	Vermittelte Kompetenzen
Arbeitsergebnisse bewerten	Vermittelte Kompetenzen

^ Vorlesung

Exemplarische inhaltliche Operationalisierung

Grundeigenschaften von Objekten und Mikroskopen

Schärfentiefe

Amplituden-, Phasen- und gemischte Objekte

optische Dichte, Absorptionskoeffizient

Brechzahl, optischer Weg, Phasenverschiebung

Phasenlage der Beugungsordnungen

Auflicht, Durchlicht, Hellfeld, Dunkelfeld

Phasen- und Interferenzmikroskope

Kontrast der Abbildung

Konstruktionsprinzipien spezieller Mikroskope

Wellenfront teilende Mikroskope

Differentieller Interferenzkontrast

Interphako

Amplitude teilende Mikroskope

Linnik Interferenzkontrast

Michelson Interferenzkontrast

Mirau Interferenzkontrast

Leitz'sches Mach-Zehner Mikroskop

Beugungsordnungen teilende Mikroskope

Mirskop mit Phasenplättchen

Zernike Phasenkontrast

Kohärenz

Sichtbarkeit von Interferenz

zeitliche Kohärenz

räumliche Kohärenz

Kohärenzanforderungen in Mikroskopen

Separate Prüfung

keine

^ Praktikum

Exemplarische inhaltliche Operationalisierung

Vergrößerungsreihe im Hellfeld-Durchlicht

Auflösungsbestimmung in einer Aperturreihe

Bildvergleich bei wechselnden Kontrastierungsmethoden

laterale und axiale Größenmessung

Formvermessung mit Linnik-Interferenz und mit konfokalen Methoden

Brechzahlbestimmung mit einem Phasenmikroskop

Isotropieuntersuchungen mit Differentiellen Interferenzkontrast

Separate Prüfung

Benotet	Nein
Frequenz	undefined
Voraussetzung für Teilnahme an Modulprüfung	Ja

Prüfungskonzept

Kenntnisse:

Vor Antritt des Praktikums sind zu Hause ausgearbeitete Aufgaben vorzulegen.

Die Grundideen zum Versuch werden vor dessen Durchführung im Gespräch erfragt.

Fertigkeiten:

Die Strategie Mikroskope zu justieren, d.h. die axiale und laterale Lage sowie Öffnung von Aperturblende und Feldblende, muss erläutert und beherrscht werden und wird in der Folge auch begleitet.

Das Versuchsprotokoll wird überprüft auf sprachliche Fähigkeiten, insbesondere Wissenschaftlichkeit und Präzision im Ausdruck und Verständnis der Sachzusammenhänge

Methoden :

Die Auswertungen, vor allem die geforderten Interpretationen der Ergebnisse, erfordern immer ein gewisses Maß an Methodenkompetenz und können so überprüft werden.